

電子基板上の異物解析ならお任せください

基板異物量調査（異物解析）

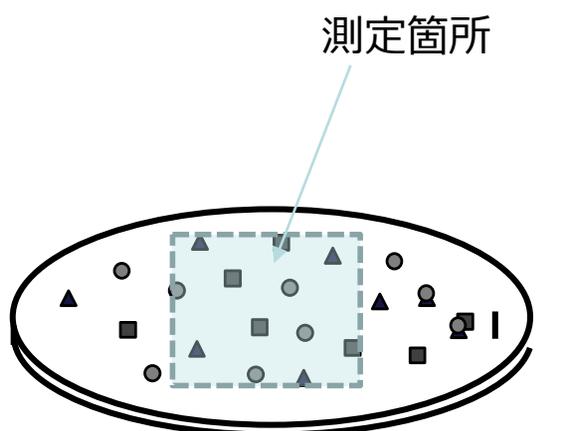
詳細はこちら www.oeg.co.jp/env_meas/wboard.html

概要 電子基板における金属異物の混入は内部短絡に繋がる可能性があるため、製品の管理として重要なものとなります。OKIエンジニアリングでは、20 μ m級の微小な金属異物の高速検出を蛍光X線分析にて行います。

特長

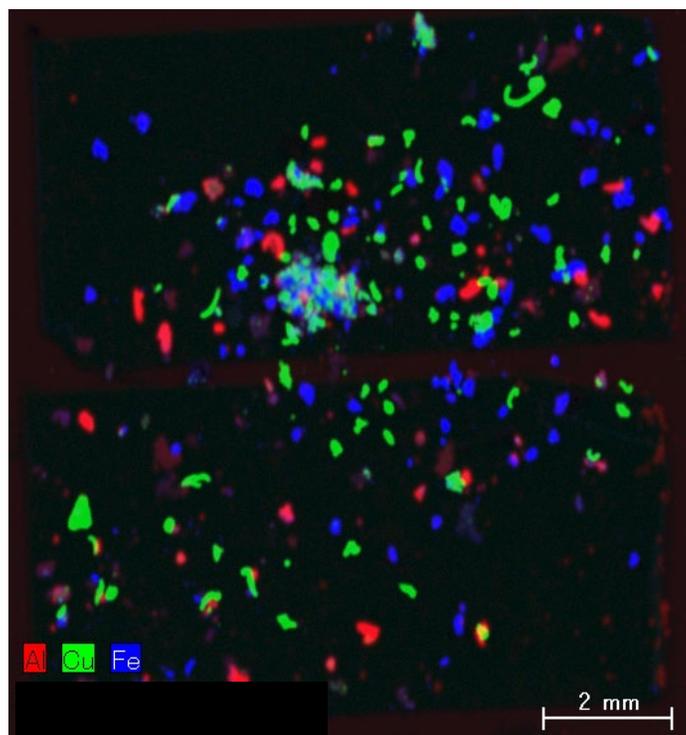
- ・電子基板を洗浄し、フィルター上の分析をおこなうことで、金属粒子（Fe、Cu、Al）の位置、分布の詳細把握が可能です。
- ・電子基板残渣のイオン成分分析についても、解析を行うことが可能です。

蛍光X線分析による基板洗浄度解析事例



試料イメージ図（フィルター）

▲ ■ ● : 金属異物



赤 : Al 緑 : Cu 青 : Fe
マッピングエリア 10mm×10mm

電子基板を洗浄したろ液をフィルターでろ過し、残存した金属異物を測定した事例です。基板洗浄後のフィルター上に、金属粒子（Fe、Cu、Al）の位置、分布の詳細を把握することが可能です。

計数測定を行うことで、洗浄度の管理が可能です。